**Чжо Ко Вин . Применение ионизирующего излучения для ускоренных испытаний на надежность МОП интегральных микросхем: диссертация ... кандидата технических наук: 05.27.01 / Чжо Ко Вин ;[Место защиты: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"].- Москва, 2014.- 99 с.**